

Сканерлейтін электронды микроскоптың техникалық сипаттамасы

(Лот 1)

Катод түрі электронды оптика және сканерлеу жүйесі – Накты уақыттағы сәулелік параметрлерді бақылау және онтайландыру және әртүрлі сканерлеу режимдерінде кескіндер алу үшін қосымша патенттеген электромагниттік линзасы (IML) бар бірегей электрондық оптика (ажыратымдылық, кеңейтілген фокус терендігі, кең көру өрісі және т.б.). – Вольфрам термиялық эмиссиялық катод. – Сканерлеуші электронды микроскоптың кеңістіктік ажыратымдылығы 30 кВ-та 3,0 нм құрайды. – Электрондар сәулесінің тогы 1 пА-дан 2 мкА-ға дейін, сәуленің тогы өзгерген кезде диафрагманы механикалық өзгерту қажет емес (косымша тан 30 кВ-қа дейінгі диапазонда. – Сканерлеудің максималды жылдамдығы-20 нс/пиксель, сканерлеудің минималды жылдамдығы-10 мс/пиксель, жылдамдық бүкіл диапазонда сатылы немесе үздіксіз реттеледі. – Бір сканерлеу кезінде $16\ 384 \times 16\ 384$ пиксельге дейінгі кескіндерді сактау, өлшем "тірі" кескін үшін (3 қадам) және 4:3, 2:1 немесе 1:1 кескін арақатынасы бар сакталған (11 қадам) үшін дербес орнатылады.

- Улгі камерасындағы жоғары вакуум 9×10^{-3} Па. – UniVacTM: 7 – 500 Па режимінің болу..
- Вакуумдық жүйе элементтерінің ешқайсысы суды салқындау жүйелерін пайдаланбайды.
- Шлюзді пайдаланбай үлгілерді ауыстыру уақыты 3 минут.
- Форвакуум және турбомолекулалық сорғыларға негізделген сорғы жүйесі.
- Айналмалы май сорғысы форвакуум сорғысы ретінде қолданылады.

Камера және үлгі үстелі:

- Өлшемдері бар аналитикалық үлкен үлгі камерасы: 230 мм (ішкі диаметрі) x 148 мм (есіктің ені).
- Детекторлар мен аксессуарларды орнатуға арналған 12 интерфейс порты.
- Үлгінің максималды биіктігі: 54 мм (айналу үстелі бар) және 81 мм (айналу үстелі жоқ).
- 5 ось бойынша толық моторланған (X, Y, Z, көлбеу, айналу) дәл координаталық репродукциясы бар бойынша -80° тан $+80^\circ$ дейін.
- Үлгінің максималды рұқсат етілген салмағы: X, Y, Z осьтері бойымен қозғалу кезінде 500 г, айналу және көлбеу; X, Y және Z осьтері бойымен қозғалу кезінде 1000 г.
- Сыртқы тербелістерді басу үшін тік болат арматурасы бар резенке үнсіз блоктары бар кірістірілген флотациялық камера мен баған супензиясы. Бөлмедегі сыртқы механикалық тербелістердің рұқсат етілген деңгейі: < 4 мкм/с 30 Гц-тен төмен, < 8 мкм/с 30 Гц-тен жоғары.

Детекторлар:

- Топографиялық контраст кескіндерін алу үшін Эверхарт-Торнли типті екінші реттік электрон детекторы 30 кВ-та 3,0 нм ажыратымдылығымен тік ось бойынша қозғалыстың барлық диапазонында қолданылады.
- Полюс ұшының астында симметриялы орналасқан синтетикалық жоғары сезімтал YAG кристалына негізделген кері шашыраңқы сцинтиляциялық типті сакина детекторы. 0,1 Z атомдық номері бойынша ажыратымдылығы бар композициялық контраст кескіндерін алу үшін тік осьтің барлық қозғалысы ауқымында қолданылады. Сканерлеудің жоғары жылдамдығын қажет ететін қосымшалар үшін ұсынылады. Детектор колмен жылжыту/ұзарту механизмімен жабдықталған.
- Кіріктірілген ток өлшегіш (пикоамперметр). Улгіге сіңірілген токты үздіксіз өлшеуді, сондай-ақ сәуле үлгі үстеліне салынған Фарадей цилиндріне орналастырылған жағдайда бастапқы электронды сәуленің тогын өлшеуді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, сіңірілген ток өлшегіш микроскоп камерасының бөліктерін (үлгіні және детекторларды корғай) сенсорлық сенсор функциясын орындауды.
- Оңай навигация және үлгі үстелінің қозғалысын бақылау үшін сандық үлкейту мүмкіндігі бар үлгі камерасын қарау ИК-телекамерасы. Улгі беті мен камера бөліктері мен детекторлар арасындағы қашықтықты визуалды бақылау (атап айтқанда, бағанның полюс ұшының астындағы детекторлар). Жарыққа сезімтал талдау түрі белсендірілген кезде ИК жарығы автоматты түрде өshedі.
- Қоғыннан көрсетілген автоматты процедура мен модульдер жиынтығы бар микроскопты басқару бойынша орыстандырылған бағдарламалық жасақтама – TESCAN Essence микроскопты басқару бағдарламалық жасақтамасы, пайдаланушыға ыңғайлы модульдік плитка түріндегі графикалық интерфейс. – Essence-те кескінді өңдеу: кескінді өңдеуден кейінгі бағдарламалық модуль, ол орындауды: кескінді айналдыру, ак-кара түске айналдыру, бірнеше детекторлар бір уақытта алған құрама суреттерден арналарды шығару, инфжолдарды косу және т. б. Блоктарға топтастырылған 30-дан астам функциялар, блоктардың атаулары:

жарықтылыкпен/контрастпен/гамма-түзетумен жұмыс, құрылымдарды анықтау, бірнеше түс схемалары бойынша түстерді бояу, геометриялық түрлендірулер, айқындық/бұлыңғырылыш, шуды басу, суреттерді біріктіру және инфждолдармен манипуляция. – Essence-тегі талдау және өлшеу: тірі суреттегі берілген сызық бойымен жарықтықтың тербеліс профильдерін нақты уақытта құруға арналған бағдарламалық модуль. Сызық бойымен сканерлеу бір реттік немесе үздіксіз қайталануы мүмкін. Жол бойындағы электронды сәуленің кадамдарының санын пайдалануши өндөйді. Таңдалған нұктелердегі жарықтық мәндерін анықтау үшін жылжымалы тік сызыштар бар. Сызық бойымен сканерлеуден басқа, электронды сәулені нұктеге "құлыптауға" болады. – Essence ішіндегі өлшемдер: тірі немесе сакталған кескіндердегі нысандарды қолмен өлшеуге арналған бағдарламалық модуль. TESCAN микроскоптарынан алынған кескіндер калибрлеуді қажет етпейді; кейінгі өлшеулер үшін үшінші тарарап кескіндерін калибрлеуге болады. Суреттерге қойылған барлық өлшеу белгілері өндөледі. Барлық өлшемдер автоматты түрде кестеге енгізіледі, оны форматта түсіруге болады .TXT, .CSV, өлшеудін статистикалық параметрлері автоматты түрде есептеледі. Суреттерге коюға болатын өлшеу белгілері: нұкте (оның координаттары мен сұр деңгейі көрсетіледі), көрсеткілер мен мәтіндік көлтәнбалар, қашықтықты өлшеу (берілген параллель түзулердің арасында немесе берілген сызықтың бойында), бұрыштарды өлшеу; шенберлер мен эллипстердің периметрлері мен аудандарын, үш нұкте өлшеу. Сондай ақ берілген сызық бойымен немесе жолактың ені бойынша орташаланған жарықтық тербелістерінің профильдері алынады. Сондай-ақ, кескінге көлденен/тік сызықтардың, концентрлік шенберлердің, радиалды сәулелердің, нұктелердің периодтық торын периодтың реттелетін енімен қолдануға болады. Сондай-ақ, кескіннің өзінде КП №231109 VEGA LMS 4 беттен 3 бетті масштабты сызышты құруға болады (егер инфостроксыз кескінмен жұмыс істей керек болса пайдалы). – Essence ішіндегі алдын ала жылдам белсендіруге арналған бағдарламалық модуль, мысалы: бағанды туралау нәтижесі, сәуле тогы, жарықтық/контраст, кону энергиясы, көрү өрісі, жұмыс қашықтығы, үлгі кестесінің координаттары. Жинақта иондық баған болған кезде иондық бағанға арналған алдын ала орнатылған блок қосылады. – Essence ішіндегі позиционер: кез-келген суретті субстрат ретінде қолдана отырып, қызығушылық аймақтарына оңай шарлауға арналған бағдарламалық модуль. Навигациялық картаның ролін атқаратын сурет фотосурет, оптикалық микроскоптың суреті, кең көрү өрісі, схемасы, сызбасы бар СЭМ кескіні болуы мүмкін. Егер субстрат суреті TESCAN микроскопының артында жинақталған СЭМ суреті болса, онда мұндай сурет пен үлгіні салыстыру автоматты түрде жүреді. Егер субстрат суреті басқа құрылғыдан немесе диаграммадан/сызбадан алынған сурет болса, онда субстрат суретін ағымдағы үлгіге байланыстыру қажет, ол 3-ші сілтеме нұктелерінде қолмен жасалады. – Essence соктығысу схемасы: СЭМ камерасының ішіндегі үлгілер мен козғалатын детекторлар/аксессуарлардың козғалысын 3D визуализациялау, козғалыстар анимация ретінде көрсетіледі және нақты уақыт режимінде жаңартылады. Бұл құрал кестені немесе үлгілерді объективті линзының полюсті ұшымен, детекторлармен және микроскоп камерасының басқа ішкі бөліктерімен соктығысуы мүмкін үлгілер үстелін жылжыту әрекеттерін болдырмау үшін қажет. – Essence ішіндегі гистограмма: гамма түзетулерін және нақты уақыт режимінде жаңартылады, сонымен қатар ренк шкаласы (LUT) реттеледі. – Essence - тегі объектілердің ауданы: таңдалған сұр деңгейдегі объектілер кадр ауданының қанша үлесін алатының анықтауға арналған бағдарламалық модуль. Сакталған суреттермен де, тірі СЭМ кескінімен де жұмыс істейді. Сұр деңгейдің әртүрлі диапазондары үшін аудандардың 4 мәніне дейін бір кадрда бөлуге болады, нәтижелер алынған сандық көрсеткіштерді кейінгі талдау үшін экспорттады. – Essence-тегі өшіру таймері: микроскопты белгіленген уақыт откеннен кейін автоматты түрде өшіруге арналған бағдарламалық модуль (оны құту режиміне кою). Ол оператордың болуын қажет етпейтін және микроскопты өшіру қажет болатын ұзақ эксперименттер басталған кезде қолданылады (әдетте мұндай эксперименттер түнде аяқталады). Ұзақ эксперименттердің мысалдары: панорама үшін СЭМ кескін массивін жинақтау, аналитикалық процедураалар (бөлшектерді автоматты түрде іздеу).

– Essence SharkSEM: электрондық баған мен үлгі үстелінің басқару элементтерімен сырткы бақылау және байланыс хаттамасы. Егер үшінші тарарап құрылғысы (мысалы, EDS энергия дисперсиялық детекторы) осы СЭМ-ге орнатылуы жоспарланған болған жағдайда қажет.

Компьютер және басқару жүйесі:

PC SEM-микроскоптың басқарушы компьютері. Сымсыз жинақ (пернетакта және тінтуір). Трекбол. Монитор-32 дюймдік кәсіби сериялы сұйық кристалды монитор.

Оператор үстелі-еңі 1600 мм әргеномикалық оператор үстелі, екі компьютерге арналған тауашасы бар; екі мониторға арналған бекіткіштері бар сәндік артқы тік панель кіреді.

Басқалары:

– Форвакуум сорғысының акустикалық шуын азайту үшін табиги конвекциялық ауамен салқындастылған шуды болдырмайтын қорап. UPS-жабдықты қорғау және қауіпсіз өшіру үшін 2,2 кВа үздіксіз қуат көзі. Шығын материалдары мен ұстаушылар:

VEGA HiVac үшін I-Y жиынтығы-1 жыл ішінде үлгілерді бекітуге арналған шығын материалдары мен ұстаушытар жиынтығы.

Жабдықты сатып алушының аумағында монтаждау жүргізілетін жерге дейін жеткізу құнға енгізілген.
Сатып алушының мамандарын пайдалануға беру және оларға кеңес беру жөніндегі жұмыстар пайдалану
кағидалары. Жұмыстарды сатып алушының аумағында өкіл компанияның сертификатталған мамандары
орындаиды.

Басқарма төрағасы – ректор

Фылым және инновация жөніндегі

Бағдарлама жетекшісі



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Рахадилов Б.К.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамын
барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа кол қойылған күннен 25.12.2023 ж. деін.